бКО.347.222-02 ТУ

573РФ2

16К (2Кх8) РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СТИРАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ

NMOП технология

Репрограммируемое постоянное запоминающее устройство с УФ-стиранием информации обеспечивает возможность долговременного хранения информации при включенном и отключенном питании и многократной смены информации.

Предназначено для работы в блоках памяти специализированных электронно-вычислительных машин, в устройствах сбора и обработки информации, устройствах информатики и контроля.

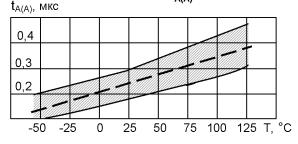
- время выборки адреса 450нс;
- напряжение питания 5В ± 10%;
- напряжение сигнала записи-считывания в момент программирования 24,5B ± 0,5B;
- допустимое значение статического потенциала не более 200В.



НАДЕЖНОСТЬ

Наработка, ч	t _μ	100 000
Срок хранения, лет	t _{xp}	25

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ $t_{A(A)}$ от T



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

1-8, 19, 22, 23	A1-A11	Вход адресный
9 -11, 13 -17	D1-D8	Вход-выход
12	ov	Общий
18	CE	Вход сигнала разрешения обращения
20	ŌE	Вход сигнала разрешения выхода
21	WR/RD	Вход сигнала записи- считывания
24	U _{CC}	Источник питания

ДОПУСТИМЫЕ ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ

Механические удары, д	1500
Линейное ускорение, g	20 000
Вибрация 1 - 5 000 Гц, д	40
Устойчивость к воде и спирто- бензиновой смеси	1:1

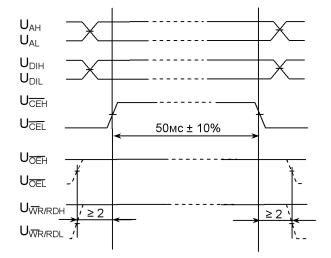
КЛИМАТИЧЕСКИЕ

Диапазон рабочих температур, °С	от - 60 до 85
Изменение температуры среды, °С	от - 60 до 125
Повышенная влажность при T = 35 °C, %	до 98
Температура пайки, °С Продолжительность, с	235 ± 5 2 ± 0,5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (U_{CC} = 5 B ± 10%)

Символ	Параметр	T, °C	573РФ2
U _{DOL}	Напряжение выхода низкого уровня , В $(I_{OL} = 2,1 \text{ мA})$	от - 60 до 85	≤0,45
U _{DOH}	Напряжение выхода высокого уровня , В $(I_{OH} = 0.4 \text{ мA})$	от - 60 до 85	≥2,4
I _{CC}	Ток потребления в режиме считывания, мА	25, 85 - 60	≤80 ≤110
I _{WR/RD}	Ток сигнала записи-считывания, мА	25, 85 - 60	≤6 ≤10
I _{CCS}	Ток потребления в режиме хранения, мА	25, 85 - 60	≤21 ≤35
I _{WR/RDS}	Ток сигнала записи-считывания в режиме хранения, мА	от - 60 до 85	≤2
I _{LI}	Ток утечки по каждому входу, мкА	от - 60 до 85	≤10
t _{A(A)}	Время выборки адреса, мкс	от - 60 до 85	≤0,45
t _{A(CE)}	Время выборки разрешения обращения, мкс	от - 60 до 85	≤0,45
t _{A(OE)}	Время выборки разрешения выхода, мкс	от - 60 до 85	≤0,25
t _{SG1}	Время хранения информации при отключённом питании, ч	85 от - 60 до 25	≥25 000 ≤100 000
t _{SG2}	Время хранения информации при включённом питании, ч	от - 60 до 85	≥25 000
Cı	Входная ёмкость вывода вход-выход, пФ	от - 60 до 85	≤12
N _{CY}	Количество циклов перепрограммирования, цикл	25 ± 10	≥100

ДИАГРАММА РЕЖИМА ЗАПИСИ



Тепловое сопротивление кристалл - корпус $0,05^{\circ}\text{C/mBt}.$

Предельное значение температуры перехода (кристалла) 130°С при $T_{\text{OKD,CD}}$ = 85°С.

Время стирания информации, с.

$$t_{\mathsf{EE}} = \frac{\mathsf{H}_{\mathsf{E}}}{\mathsf{E}_{\mathsf{F}}},$$
 где

 E_E — измеренное значение энергетической освещённости в плоскости окна корпуса, BT/m^2 ; $H_E = 1,5\cdot 10^5~BT\cdot c/m^2$ — требуемое значение энергетической экспозиции для стирания информации в микросхеме.

Стирание информации проводят путём воздействия ультрафиолетового излучения с длиной волны 253,7нм;

Возможна запись информации серией импульсов последовательно по одному импульсу в каждый адрес.